

FORD LDM Localization - 功能 #3135

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety
功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test

2024-11-28 10:29 - 盛炜 朱

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-08
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
RAM test shall be implemented during one operation cycle, in case of fault, MCU shall be reset			
SW Fault Handling time: 400ms			
Safe State: reset			

历史记录

#1 - 2024-11-28 19:59 - 希星 柯

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-08
- 指派给 从 斌 徐 变更为 希星 柯
- 开始日期 被设置为 2024-12-08

#2 - 2025-03-03 13:44 - 涛 陆

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全部分目标版本更改为3.2

#3 - 2025-03-03 19:49 - 希星 柯

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-04 10:46 - 希星 柯

- % 完成 从 0 变更为 100